

國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班

碩士論文

利用一種新穎結構進行複晶矽薄膜電晶體之熱
載子可靠性分析



**A Study of Hot-Carrier Reliability for Poly-Si Thin-Film
Transistors Using a Novel Test Structure**

研究生:張凱翔

指導教授:林鴻志 博士

黃調元 博士

中華民國九十七年八月

利用一種新穎結構進行複晶矽薄膜電晶體之熱
載子可靠性分析

**A Study of Hot-Carrier Reliability for Poly-Si Thin-Film
Transistors Using a Novel Test Structure**

研究生:張凱翔
指導教授:林鴻志 博士
黃調元 博士

Student: Kai-Hsiang Chang
Advisors: Dr. Horng-Chih Lin
Dr. Tiao-Yuan Huang

國立交通大學

電子工程學系  電子研究所碩士班

碩士論文

A Thesis

Submitted to Department of Electronics Engineering & Institute of Electronics
College of Electrical and Computer Engineering

National Chiao-Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master

in

Electronic Engineering

July 2008

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十七年八月